



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE
Dr. Hartmut Stadler VEECO

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 - Αίθουσα Σεμιναρίων 307
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Εταιρεία VEECO – πρωτοπόρος στη Μετρολογία – συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον οίκο Veeco και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Χημείας, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμ. Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου θα παρουσιαστούν οι νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της **Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM)** & **Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM)**, από τον ειδικό επιστήμονα Dr. Hartmut Stadler.

Πρόγραμμα

10:00-10:10	Welcome to the Seminar	N. Χανιωτάκης / Δ. Σταμέλος
10.10-11:45	Veeco Introduction & Scanning Probe Microscopy New Trends & Developments	Dr. H. Stadler
11:45-12.00	<i>Διάλειμμα - Καφές - Αναψυκτικά</i>	
12:00-13:30	SPM/AFM Applications in Materials, Polymers and Biological samples	Dr. H. Stadler
13:30-14:00	Open Discussion - Demonstration	

Υπάρχει εγκατεστημένο όργανο SPM/AFM (Model Innova) στο εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, το οποίο μπορεί να επιδειχθεί μετά το τέλος της ημερίδας.

Θα δοθεί *Βεβαίωση Συμμετοχής* σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Μετρολογίας VEECO.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009, στην κα Ράνια Γεωργίου, τηλ. 210-6748973 (εσ. 810) ή fax 210-6748978, ή e-mail rgeorgiou@analytical.gr

Με εκτίμηση,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Δ. Σταμέλος
Χημικός
Δ/ντής Πωλήσεων Veeco